



POLITECNICO
MILANO 1863

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE DI MISURA HIGH VOLTAGE PROBE STATION
CIG 8932708FD2**

**VERBALE DI GARA n. 2
16 dicembre 2021**

Il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre dell'anno 2021, alle ore 15:50, si riunisce la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto in modalità telematica attraverso l'ausilio della piattaforma Teams che garantisce la riservatezza delle comunicazioni, così come previsto dall'art.77 – comma 2 del D.Lgs 50/2026;

PREMESSO

- che con Decreto del Direttore Generale Repertorio 8845/2020, Protocollo n. 163977 del 07/10/2021 è stata indetta procedura di gara europea a procedura aperta per l'affidamento della "fornitura e installazione di una stazione di misura high voltage probe station", utilizzando come piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA Regione Lombardia CIG 8932708FD2;
- che con Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 11141/2021, Protocollo n. 0210570 del 2/12/2021, è stata incaricata la Commissione giudicatrice composta da:

Prof. Giacomo Langfelder – Presidente
Prof. Ivan Rech – Componente
Prof. Alessandro Sottocornola Spinelli – Componente
Dott. Salvatore Palermo – Segretario Verbalizzante

- che come da verbale Rep 209/2021 prot. n. 195754 del 12/11/2021 risultano tempestivamente depositate sul sistema informatico di gestione gare del Politecnico di Milano, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, n. 2 (due) offerte telematiche da parte dei seguenti concorrenti, correttamente firmate digitalmente, come nel seguito riportato:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA
1636721564773	DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL 05058341214	Forma singola	venerdì 12 novembre 2021 13.52.44 CET	Valida
1636717037148	ELECTRON MEC SRL 01773040157	Forma singola	venerdì 12 novembre 2021 12.37.17 CET	Valida

- che in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, il Politecnico di Milano si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti. Pertanto, tutte le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della Documentazione Amministrativa; Il RUP, in seduta riservata, procederà alla verifica della Documentazione Amministrativa in capo al concorrente risultato primo in graduatoria.
- che la commissione giudicatrice si è riunita in data 15/12/2021 per la verifica dell'offerta tecnica presentata dai soggetti offerenti e l'attribuzione dei punteggi tabellari/discrezionali con stesura del verbale n. 1 Repertorio n. 230/2021 Prot n. 219588 del 15/12/2021

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, la Commissione giudicatrice, come sopra costituita, constata un mero errore di battitura nell'attribuzione dei punteggi sulla conformità dei materiali nel punto di seguito indicato:

C.3 Possibilità di movimentazione manuale del chuck

Sarà valutata la possibilità di movimentazione manuale della posizione del chuck in aggiunta alla possibilità di movimentazione tramite software richiesta nel Capitolato Tecnico, come di seguito dettagliato:

- a) Possibilità di movimentazione manuale: 2 punti;
- b) Nessuna possibilità di movimentazione manuale: 0 punti.

Nel verbale n. 1 del 15/12/2021 era stato indicato erroneamente 5 anziché 2, di seguito l'assegnazione corretta del punteggio assegnato nel punto C.3:

C.3 Possibilità di movimentazione manuale del chuck – 2 punti

DISTEK: Conferma la possibilità di movimentazione manuale del chuck.

EMEC: Conferma la possibilità di movimentazione manuale del chuck.

Criterio		DISTEK	EMEC
C.3	Possibilità di movimentazione manuale del chuck	2	2

Al termine delle valutazioni, la Commissione procede quindi a riepilogare i punteggi, in seguito alla correzione relativi ai criteri tabellari risultanti attribuiti alle ditte concorrenti, a quanto offerto in sede di gara tramite piattaforma telematica Sintel e riportati nella tabella seguente:

PUNTEGGI TABELLARI		DISTEK	EMEC
A.1	Estensione della garanzia	5	2
A.2	Tempi di consegna	2	0
A.4	Possibilità di espansione del sistema di misura con probe-card di alta tensione	5	5
C.3	Possibilità di movimentazione manuale del chuck	2	2
Totale		14	9

Al termine della modifica la commissione procede a riepilogare i punteggi corretti risultanti così come segue:

CRITERI TABELLARI

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI
DISTEK	14
EMEC	9

CRITERI DISCREZIONALI

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI
DISTEK	42,79
EMEC	72,25

TOTALE PUNTEGGI

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI
DISTEK	56,79
EMEC	81,25

Alle ore 16:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta

La documentazione relativa alla gara è conservata nel sistema telematico e-procurement SINTEL della Regione Lombardia.

Il presente verbale è composto da n. 3 (tre) pagine più una pagina di allegato.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, lì 16.12.2021

Presidente	Prof. Giacomo Langfelder
Commissario	Prof. Ivan Rech
Commissario	Prof. Alessandro Sottocornola Spinelli
Segretario verbalizzante	Dott. Salvatore Palermo

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE DI MISURA HIGH VOLTAGE PROBE STATION	CIG 8932708FD2	Allegato 1			
--	----------------	------------	--	--	--

DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL								
Criterio	Descrizione	Max punti	LANGFELDER	RECH	SOTTOCORNOLA SPINELLI	Media	Riparametrata	Punti
A.3	Compatibilità con lo strumento "Power Device Analyzer B1505A" di Keysight Technologies e con i suoi moduli di espansione "N1268A" e "N1260A"	10	1,00	1,00	1,00	1	1	10
B.1	Box di protezione	7	0,30	0,50	0,50	0,43333333	0,43	3,01
B.2	Sistemi di inter-lock	7	0,50	0,50	0,50	0,5	0,59	4,13
B.3	Soluzioni di anti-arcing	4	0,10	0,10	0,10	0,1	0,1	0,4
C.1	Sistema di tenuta del wafer e possibilità di misura di porzioni di wafer	5	0,10	0,00	0,10	0,06666667	0,07	0,35
C.2	Sistema per l'alloggiamento del wafer sul chuck	5	0,00	0,10	0,10	0,06666667	0,07	0,35
D.1	Sistema multi-view (integrato con il software di utilizzo della probe station)	5	1,00	1,00	1,00	1	1	5
D.2	Semplicità delle operazioni di sostituzione delle lenti	2	1,00	1,00	1,00	1	1	2
D.3	Caratteristiche in termini di field-of-view, risoluzione ottica, range di focalizzazione, sistema di illuminazione	3	0,85	0,85	1,00	0,9	0,9	2,7
E.1	Interfaccia grafica	5	1,00	1,00	1,00	1	1	5
E.2	Wafer mapping, visualizzazione dei die, controllo della contattatura dei campioni	5	0,85	0,60	0,85	0,76666667	0,77	3,85
E.3	Creazione di test da svolgere in sequenza ed in maniera automatica su molteplici campioni del wafer	5	1,00	1,00	1,00	1	1	5
F.1	Condizioni di assistenza	10	0,10	0,10	0,10	0,1	0,1	1
TOTALE		73						42,79

ELECTRON MEC SRL								
Criterio	Descrizione	Max punti	LANGFELDER	RECH	SOTTOCORNOLA SPINELLI	Media	Riparametrata	Punti
A.3	Compatibilità con lo strumento "Power Device Analyzer B1505A" di Keysight Technologies e con i suoi moduli di espansione "N1268A" e "N1260A"	10	1,00	1,00	1,00	1	1	10
B.1	Box di protezione	7	1,00	1,00	1,00	1	1	7
B.2	Sistemi di inter-lock	7	0,85	0,85	0,85	0,85	1	7
B.3	Soluzioni di anti-arcing	4	1,00	1,00	1,00	1	1	4
C.1	Sistema di tenuta del wafer e possibilità di misura di porzioni di wafer	5	1,00	1,00	1,00	1	1	5
C.2	Sistema per l'alloggiamento del wafer sul chuck	5	1,00	1,00	1,00	1	1	5
D.1	Sistema multi-view (integrato con il software di utilizzo della probe station)	5	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	4,25
D.2	Semplicità delle operazioni di sostituzione delle lenti	2	1,00	1,00	1,00	1	1	2
D.3	Caratteristiche in termini di field-of-view, risoluzione ottica, range di focalizzazione, sistema di illuminazione	3	1,00	1,00	1,00	1	1	3
E.1	Interfaccia grafica	5	1,00	1,00	1,00	1	1	5
E.2	Wafer mapping, visualizzazione dei die, controllo della contattatura dei campioni	5	1,00	1,00	1,00	1	1	5
E.3	Creazione di test da svolgere in sequenza ed in maniera automatica su molteplici campioni del wafer	5	1,00	1,00	1,00	1	1	5
F.1	Condizioni di assistenza	10	1,00	1,00	1,00	1	1	10
TOTALE		73						72,25

	PUNTEGGI TABELLARI	DISTEK	EMEC
A.1	Estensione della garanzia	5,00	2,00
A.2	Tempi di consegna	2,00	0,00
A.4	Possibilità di espansione del sistema di misura con probe-card di alta tensione	5,00	5,00
C.3	Possibilità di movimentazione manuale del chuck	2,00	2,00
Totale		14,00	9,00

PUNTEGGIO TOTALE Criteri discrezionali+Criteri Tabellari	
DISTEK STRUMENTI & MISURE S	56,79
ELECTRON MEC SRL	81,25